



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)

П Р И К А З

25.12 2018

№ 1121.

г. Киров

**Об утверждении Прейскуранта на платные услуги, оказываемые
Научно-образовательным центром по направлению «Нанотехнологии»**

В целях организации университетом платных услуг, оказываемых Научно-образовательным центром по направлению «Нанотехнологии», на основании утвержденных калькуляций стоимости услуг п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Прейскурант на платные услуги, оказываемые Научно-образовательным центром по направлению «Нанотехнологии» (Приложение).

2. Считать утратившим силу приказ от 24.02.2012 № 48 «Об утверждении прейскуранта».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера – руководителя Департамента экономики и финансов Пересторонина С.А.

Ректор

В.Н. Пугач

Главный бухгалтер – руководитель
Департамента экономики и финансов

Пересторонин С.А.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом ВятГУ

от 25.12.2018 № 1121

ПРЕЙСКУРАНТ

на платные услуги, оказываемые Научно-образовательным центром по направлению «Нанотехнологии»

№ п/п	Наименование услуги	Описание услуги	Условия оказания услуги	Стоимость услуги, в т.ч. НДС 20%, руб.
1.	Оптическая микроскопия	Стереомикроскоп SMZ-1500, Nikon. Визуализация объектов в проходящем и падающем свете с увеличением до x120, определение геометрических параметров, микрофотография.	Максимальный размер объектов 100x100x50 мм	417,00
2.	Растровая электронная микроскопия поверхности образца (РЭМ)	Микроскоп JSM-6510 LV, JEOL. Исследование топографии поверхности образца, морфометрия структурных единиц в условиях высокого вакуума с детекцией вторичных или отраженных электронов (до 20 микрофотографий).	Максимальный размер образца 55x55x20 мм. Для образцов с низкой электропроводимостью требуется пробоподготовка с напылением токопроводящего слоя.	1466,00
3.	Растровая электронная микроскопия биологических объектов (РЭМ)	Микроскоп JSM-6510 LV, JEOL. Исследование биологических объектов, морфометрия структурных единиц в условиях низкого вакуума с детекцией отраженных	Анализ сухой пробы либо высушенной капли взвеси. Для образцов с низкой электропроводимостью требуется пробоподготовка с напылением токопроводящего	1562,00

		электронов (до 20 микрофотографий).	слоя.	
4.	Статистический анализ размеров структурных элементов по данным РЭМ	Проведение статистического анализа размеров структурных элементов образца по данным РЭМ (до 5 микрофотографий).		1000,00
5.	Анализ химического состава методом электронно-зондового микроанализа (EDX)	Энергодисперсионный спектрометр Inca X-MAX, Oxford Instruments, на базе микроскопа JSM-6510 LV, JEOL. Анализ химического состава выделенных областей (до 10 участков) образца.	Максимальный размер образца 55x55x20 мм	985,00
6.	Элементное картирование поверхности методом электронно-зондового микроанализа (EDX)	Энергодисперсионный спектрометр Inca X-MAX, Oxford Instruments, на базе микроскопа JSM-6510 LV, JEOL. Картирование химического состава по поверхности образца (не более 30 мин. на образец).	Максимальный размер образца 55x55x20 мм	2330,00
7.	Зондовая микроскопия поверхности образца (АСМ)	Микроскоп Ntegra Prima, NT-MDT. Исследование топографии поверхности образца методом атомно-силовой микроскопии в контактном/полуконтактном режиме (высотный, фазовый, амплитудный контраст). Изучение рельефа в субмикронном диапазоне стандартными зондами. Область сканирования до 100x100 мкм.	Максимальный размер образца 30x30x15 мм, вес не более 30г, высота рельефа менее 20 нм	2468,00

17.	Вакуумное напыление углерода (ПЭМ)	Пробоподготовка для ПЭМ (установка JEE-420, JEOL).		449,00
18.	Вакуумное напыление платины (СЭМ)	Пробоподготовка для РЭМ (установка JFC-1600, JEOL). Вакуумное напыление токопроводящего слоя толщиной до 30 нм.		497,00
19.	Приготовление тонких срезов биологических материалов	Микротом-криостат НМ 525, Carl Zeiss. Приготовление срезов быстро замороженных органов и тканей животных, человека и растений для микроскопического исследования, диапазон температур до -60°C, минимальная толщина срезов до 3 мкм.	Размер образца не более 20x20x20 мм	449,00
20.	Качественный рентгенофазовый анализ поликристаллических образцов	Порошковый дифрактометр XRD-7000, Shimadzu	Мелкокристаллический порошок (массой не менее 1г) или плоский металлический шлиф диаметром 20мм (толщиной 2мм)	1850,00

Главный бухгалтер - руководитель
Департамента экономики и финансов



С.А. Пересторонин